

2010年7月30日

日本エフイー・アイ株式会社に対する特許侵害損害賠償請求の訴訟について

株式会社日立ハイテクノロジーズは、2010年7月29日に、日本エフイー・アイ株式会社を当社の集束イオンビーム技術に関連する特許を侵害したとして、損害賠償の請求等を東京地方裁判所に提訴しました。

なお、2009年11月6日に、日本エフイー・アイ株式会社が日本国内における被疑製品の製造、販売等することを差し止めるよう東京地方裁判所に提訴しており*、現在係争中です。

*) http://www.hitachi-hitec.com/news_events/product/2009/nr20091106_2.pdf

(ご参考)

FEI Company 製 FIB/SEM 装置の税関による輸入差止について

http://www.hitachi-hitec.com/news_events/ir/2010/nr20100630.pdf

【報道関係問い合わせ先】

社長室 広報・IR グループ 担当：松本

TEL：03-3504-3258